Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/541,237	FUJITA ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Jean F. Duverne	2839	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
439	630	10/1/2006	JFD	
	632			
	61-66			
	632			
	630			
	67			
	593	10/1/2006	JFD	
		_		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
· -· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			